

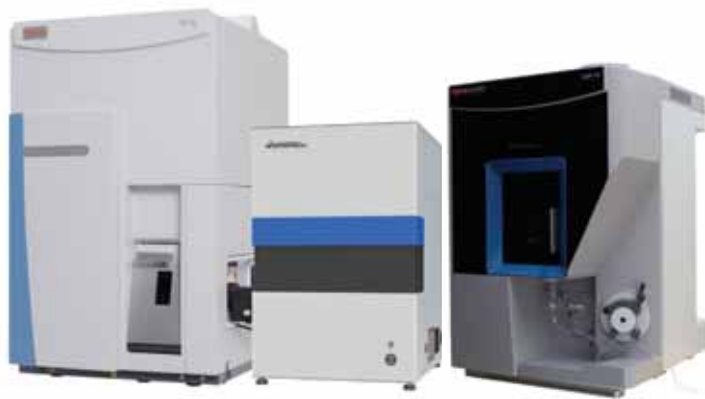
Elemental analysis

半導体製造プロセスにおける微量金属分析 に新たなソリューション

ソリッドネブライザーICP-MS/OES

Jupiter™ /Junoソリッドネブライザーは、固体試料の直接多角的な組成分析が可能です。

ICP質量分析計 (ICP-MS) と組み合わせることで半導体の表面分析だけでなく、定量性に優れた深さ方向の元素組成分析による3次元イメージングを、ICP発光分光分析装置 (ICP-OES) と組み合わせることで難溶性試料をそのまま測定する手軽さを実現します。



より深く包括的に元素分布を捉える

Jupiter™ ソリッドネブライザーiCAP TQ ICP-MS

パワー半導体に代表される新素材の開発では、3Dイメージングによる多角的な分析が求められ、広範囲 (数mm角以上) の表面元素分布と深さ方向 (数100 mm程度) の高感度分析を迅速に行うニーズが高まっています。レーザーの高速多点照射によって、固体試料中の元素を短時間かつ高感度に検出できるソリッドネブライザーICP-MSにより、表面元素分布の分析だけでなく、薄膜メッキ層の元素構造および不純物元素を明らかにする深さ方向分析、およびそれらを組み合わせた3D元素イメージング分析が可能です。

前処理の負担を少なく不溶性/難溶性サンプルの定量分析

JunoソリッドネブライザーiCAP PRO ICP-OES

現在注目されている化合物半導体であるGaN、SiC、SiNiは、難溶性材料であり、前処理として試料の溶液化を必要とする一般的なICP-MSでの分析は困難です。固体試料を直接分析できるソリッドネブライザーICP-OESを使用することで、試料中の微量金属元素および不純物分析を簡便に実施可能で、大幅な生産性向上を期待できます。さらに本システムは、マトリックスマッチング手法を用いて、特許申請中の独自の増感技術により溶液ICP発光分析の感度と精度を上回る性能を実現しております。

詳細はこちらをご覧ください

thermofisher.com/jp-elementalsite

thermo scientific

Thermo Scientific元素分析装置 お役立ち情報サイト公開中!

当社の元素分析装置のお役立ち情報をまとめたサイトを開設しました。

微量元素分析向けのICP発光分光分析装置、ICP質量分析計から安定同位体比分析装置まで、最新情報と技術資料などをご案内する特設ページへのリンクを掲載しております。固体直接分析を行えるソリッドネブライザーの技術資料や新製品情報などの注目トピックを発信しておりますので、ぜひご覧ください。



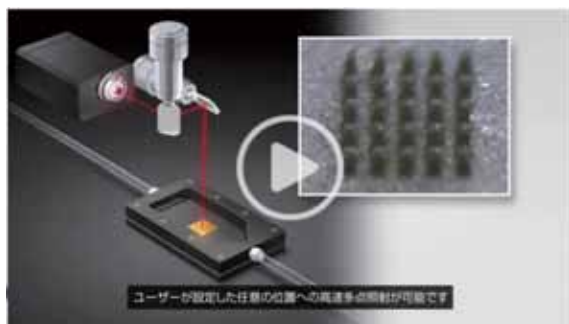
Juno ソリッドネブライザー +
Thermo Scientific™ iCAP™ TQ
トリプル四重極 ICP-MS



Thermo Scientific™
iCAP™ PROシリーズ
ICP-OES



Thermo Scientific™
ELEMENT 2™ / XR™
二重収束型高分解能ICP-MS



Jupiter™ ソリッドネブライザーの原理や操作を動画でわかりやすくご覧いただけます



上記Webサイト情報／製品資料をご希望の方は、**かんたん資料請求シート**もしくはWebの資料請求フォーム**カタログ請求欄**にチェックをしてください

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。

© 2022 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

Jupiter is a trademark of ST Japan INC.

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc **ELE139-B22100B**

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

分析機器に関するお問い合わせはこちら

TEL : 0120-753-670 FAX : 0120-753-671

Analyze.jp@thermofisher.com

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com